

LP20: Diffraction par des structures périodiques

Niveau: Licence

Prérequis: diffraction (théorème de translation, figures),
interférences

On a vu que un objet diffracte la lumière aboutissant à une figure caractéristique de l'objet (lié par TF).

Si on considère deux fentes on a vu que les interférences produisent des figures d'interf. dans la figure de diffraction.

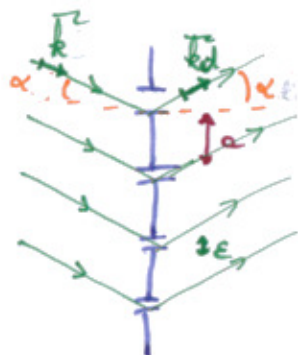
Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas des réseaux dans lequel on multiplie le nombre de fente.

à rajouter influence de la densité d'objet diffractant

I - Réseau de diffraction à 1D.

1.1. Situation.

Comme en diffraction, un faisceau // arrive sur une structure de fente régulièrement espacée



N fentes

(commentaire sur réseau transmission et réflexion)

"On commence par considérer un faisceau monochrom.

On a vu en diffraction qu'une fente produit une figure de diffraction, dont le centre est l'image de la source par la lentille, indépendamment de la position transverse du réseau.

Si donc chaque figure de chaque fente se superpose.

Mais on a vu que lorsqu'on déplace une fente, l'onde subit une diff de marche qui induit un écart de phase donnée par le théorème de translation"

$$\underline{E}(M, \epsilon) = e^{i(\vec{k}_d - \vec{k}_i) \cdot \vec{OO'}} \underline{E}(M, \epsilon)$$

où $\underline{E}(M, \epsilon)$ transmise par fente en O.
 $\underline{E}'(M, \epsilon)$ ————— O'

On comprend bien que si structure non périodique
 → phase arbitraire → $I = \sum_i I_i$

Mais si périodique i.e. $\vec{a_0} = \vec{a}$ $p \in \mathbb{N}$,
 il y a une relation de phase et chaque tâche de diffraction interfère

"Pour comprendre effet calculons l'intensité"

4.2. Calcul de l'intensité

$$\begin{aligned} \underline{E_{tot}} &= \sum_{j=1}^N \underline{E_j}(\vec{r}) \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i(\vec{k_d} - \vec{k_i}) \cdot \vec{a_j}} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a_j} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \times e^{i \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a} \end{aligned}$$

$u = \frac{(\sin \alpha - \sin \alpha_i)}{\lambda}$

$\Delta \varphi = 2\pi u a$
 ↳ déphasage entre 2 fentes.

→ suite géo:

$$\begin{aligned} \underline{E}(\vec{r}) &= \underline{E_1}(\vec{r}) \frac{1 - e^{i \Delta \varphi N}}{1 - e^{i \Delta \varphi}} \\ &= \underline{E_1}(\vec{r}) \frac{e^{i \frac{\Delta \varphi}{2} N}}{e^{i \frac{\Delta \varphi}{2}}} \frac{(e^{-i \frac{\Delta \varphi}{2} N} - e^{i \frac{\Delta \varphi}{2} N})}{(e^{-i \frac{\Delta \varphi}{2}} - e^{i \frac{\Delta \varphi}{2}})} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{E}(M, \varphi) = \underbrace{\underline{E}_1(M, \varphi)}_{\text{terme l.i. mul.}} e^{i(N-1)\frac{\Delta\varphi}{2}} \frac{\sin N\frac{\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}$$

$$\rightarrow I \propto |\underline{E}|^2$$

$$I = \underbrace{I_{d,1}(M)}_{\text{figure de diff. d'une fente.}} \left[\frac{\sin N\frac{\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} \right]^2$$

E^2 si pas dans E_0

$$I = I_0 \operatorname{sinc}^2(\pi u \varepsilon) \left[\frac{\sin \pi u N a}{\sin \pi u a} \right]^2$$

facteur de forme
"de l'objet diffractant"

en mesurant on
remonte à la forme de
l'objet

\rightarrow freq $1/\varepsilon$

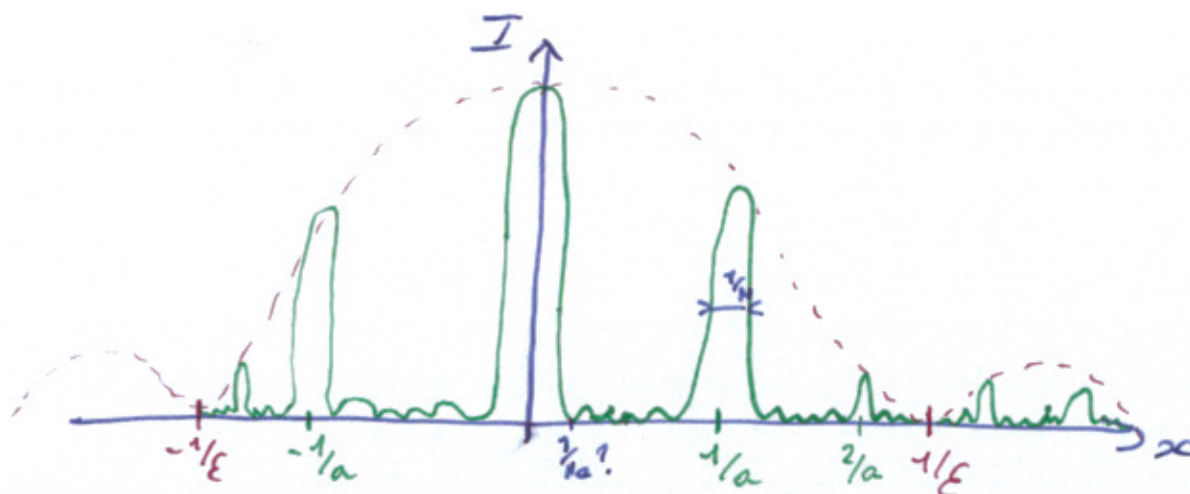
facteur de structure
"du réseau"

en mesurant on
remonte à structure

\rightarrow freq $1/a$

\rightarrow com
sur TF
des deux

$$1/a < 1/\varepsilon$$



$N \rightarrow +\infty$ dirac

L'onde n'est ~~cohérente~~ ^{constructive} qu'à certains endroits ⁽⁵⁾
 de la tache de diffraction \rightarrow on obtient des structures
 qui tendent vers un peigne de dirac ($N \rightarrow \infty$) (multi-
 plié par la fig de diff.

II - "On a analysé la figure pour monochrom, si
 polychrom, chaque λ va donner cond d'interf
 à \neq endroit \rightarrow ce qui va permettre de caractériser
 la source".

II - Etude spectrale d'une source.

2.1. Loi des réseaux

On pourrait faire un calcul de diff de marche.

$$\Delta \varphi = p 2\pi$$

"

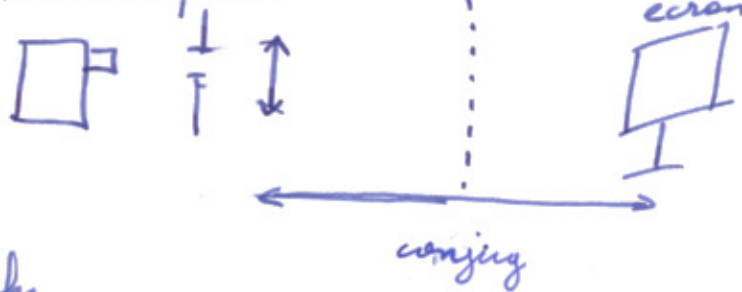
$$\frac{2\pi}{\lambda} (\sin \alpha - \sin \alpha_i) a = p 2\pi \quad p \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{(\sin \alpha - \sin \alpha_i) = p \frac{\lambda}{a}}.$$

La position des maxima (α) dépend de λ .
 \rightarrow la lumière est dispersée.

2.2. Mise en pratique

exp :



en lum blanche
puis phosores Hg.

+ filtre 545 nm.

mesure $\alpha - \alpha_i$

avec $\tan \alpha - \alpha_i \approx \alpha - \alpha_i$
 d''/L .

→ on remonte à a .

par $a \approx 100 \text{ ligne/mm}$
 $= 10 \mu\text{m}$.

→ on a corrélation mais on peut faire inverse.

2.3. Pouvoir de résolution